嘉南藥理科技大學專題研究計畫成果報告

石化產業有害廢氣排放逸散之特徵研究(整合型計畫第一年)—子計畫(2/5)—以電漿系統由石化產業硫化氫廢氣中回收氫氣及元素硫之研究

計畫類別:□個別型計畫 ■整合型計畫

計畫編號: CNEE93-04 子計畫 (2)

執行期間:93年1月1日至93年12月31日

計畫總主持人: 蔡瀛逸

子計畫主持人:施明良

執行單位:環境工程與科學系

中華民國九十四年二月二十日

嘉南藥理科技大學教師專題研究計畫成果報告

石化產業有害廢氣排放逸散之特徵研究(整合型計畫第一年)—子計畫 (2/5)-以電漿系統由石化產業硫化氫廢氣中回收氫氣及元素硫之 研究

Recovery of Hydrogen and Elemental Sulfur from Hydrogen Sulfide by RF plasma

計畫編號: CNEE93-04 子計畫 (2)

執行期限:93年1月1日至93年12月31日

總主持人:蔡瀛逸 嘉南藥理科技大學環境工程與科學系 副教授子計畫主持人:施明良 嘉南藥理科技大學環境工程與科學系 副教授

一、中文摘要

石油煉解與天然氣純化過程中,會產生 許多硫化氫(H2S)廢氣,H2S為一種毒性氣 體,在 0.01 ppm 低濃度下即可造成健康上 之危害,因此,當製程尾氣排放 H2S 時, 將會造成環境及健康上之影響。本研究利 用高週波(RF)電漿,在低壓環境下將硫化 氫分解成氫氣及元素硫, 並探討其回收之 潛力。實驗結果顯示 H2S 在較低濃度下 (2500 ppm), 功率由 5W 提高至 40W 時, H₂S 分解率(η_{H2S})由 90%增加至 100%。H₂S 濃度增加至 5900 ppm 時,分 解率明顯下降,功率 5W 時,ηH2S 為 72%, 當功率提高至 40W 時, η_{H2S} 則增 加至 86%。功率小於 10W 時,濃度 2500 ppm H₂S 中之硫轉化成元素硫之質量分率 約為 67%, 而濃度 5900 ppm H₂S 中之硫 轉化成元素硫之質量分率約為24%。當功 率增加至 10W 以上, H2S 分解率達到 99%以上時,H₂S中之硫轉化成元素硫質 量分率則達到 85%。當 H₂S 進流濃度為 5900 ppm,增加功率對 H₂S 分解率影響 較小,因此元素硫質量分率變化較不明 顯。

關鍵詞:硫化氫、高週波電漿、元素硫、 氫氣

Abstract

In process of petroleum pyrolysis and natural gas purification, hydrogen sulfide (H₂S) will be one of the products. H₂S is a toxic gas. It can cause health risk even under concentration of 0.01 ppm. As the offgas of industrial process containing H₂S, it will endanger the environment and public health. The objective of this study is to use the RF plasma to decompose H₂S into hydrogen and elemental sulfur for recovery. Experimental results indicated that n_{H2S} increased from 90% to 100% under 2500 ppm of H₂S and power increased from 5W to 40W. When H₂S concentration increased to 5900 ppm, the η_{H2S} reduced to 72% and 86% at power of 5W and 40W, respectively. As power under 10W, the mass distribution of sulfur from H₂S to elemental sulfur was 67% and 24% for H₂S concentration at 2500 ppm and 5900 ppm, respectively. As power higher than 10W, the mass distribution of sulfur from H₂S to elemental sulfur increased obviously to 85% at 2500 ppm. But it was only slightly increased for H₂S concentration at 5900 ppm.

Keywords: hydrogen sulfide, RF plasma, elemental sulfur, hydrogen

二、緣由與目的

近年來酸雨情形日趨嚴重,大量使用 含硫燃料更是罪魁禍首之一。所以工業國 家紛紛訂定法令降低大眾用燃料之硫含 量。以石油煉製業為例,由於天然石油中 大都含有硫份(有機硫及無機硫)其成份及 比率隨石油產地而不同由近乎零至高達 7.5% (重量比),而天然氣及煤氣之開採生 產中,也伴隨 0.3~3.0%之硫化氫。此外, 廢鹼液中和觸媒氧化處理煉油廠蒸餾工場 產生之廢鹼,也含高濃度硫化氫(3~6wt%) 【1-2】。工業界為了配合增產低硫燃料, 因而產生更多硫化氫廢氣。硫化氫(H₂S) 為一種毒性氣體,在 0.01ppm 低濃度下即 可造成健康上之危害,因此,當製程尾氣 排放 H₂S 時,將會造成環境及健康上之影 響【3】。

電漿技術目前已廣泛用來處理有害空 氣污染物,在各種電漿當中,如 Nicholas 等人利用高週波(RF)脈衝式電漿進行 NH3之分解【4】,Liao 等人以 RF 電 漿分解環氧乙烷【5】, Hsieh 等人以 RF 電漿分解甲烷溫室氣體【6】及 Wang 等人以 RF 電漿分解含氟之 CCl₂F₂ 及 CHF3 等溫室氣體【7-8】,作者也曾經 以 O₂/Ar RF 電漿探討 SF₆ 之分解反應 【9】。RF 電漿之耗能率較其他電漿為 低,且可形成大面積之穩定電漿,而相關 設備容易取得,且其反應器及電極之設計 較具有彈性,再加上國內技術純熟度高, 因此,以 RF 電漿處理排放廢氣具備極佳 之競爭力【10-12】。由於在低壓下 RF 電 漿具有將硫化氫分解成氫氣及元素硫之潛 力,因此,本計畫主要探討石化產業製程 硫化氫廢氣之處理與產物回收之方式。

三、研究方法

本研究之裝置與實驗流程,主要是將 H_2S (96% purity)及載體 Ar,於室溫(約

30□左右)之條件下,分別經由質量流量 控制器調整配比後,經混合器充分混合再 導入包覆外部銅片電極之玻璃反應器中, 在高週波產生器及匹配器之控制下,設定 供應功率,於低壓環境下將進料之混和氣 體激發產生電漿,反應前後之反應物及產 物主要是利用 FTIR 連續監測並加以定性 與定量, 硫元素及氫氣產生量則以質量平 衡法計算。後電漿區之沈積物,經收集 及保存於氮氣填充之採樣袋中,以 SEM-EDS (Noran, Voyager 1000) 及 XRD (RIGAKU Model D/MAX III-V)定性 及半定量分析。實驗參數及範圍設定 為:混合氣體總流量 100 sccm,其中 H₂S 進流濃度為 2500 ppm 及 5900 ppm,操作 壓力 10 torr 以及 5~40W 之輸入功率。

四、結果與討論

1.分解率之比較

■ 圖一顯示在 H₂S 進流濃度分別為 2500 ppm 及 5900 ppm 時,不同輸入功率 (5~40W)對 H₂S 分解率(η_{SF6})之影響。在 較低濃度下(2500 ppm),功率由 5W 提 高至 40W 時, η_{H2S} 由 90%增加至 100%。在 H₂S 進流濃度增加一倍以上至 5900 ppm 時, H₂S 分解率明顯下降,功率 5W 時,η_{H2S} 為 72%,功率提高至 10W 時,η_{H2S} 由 72%明顯增加至 81%,當功 率提高至 40W 時,η_{H2S} 則增加至 86%。 由於系統在加入較多 H2S 時,會降低 E/P 比 (E 為電場強度,P 為壓力), 導致較低之平均電子能量【13-14】,因 此,抑制電子碰撞形成自由基及 NH2S 之分解。然而,當功率增加時, η_{H2S} 受 到 H₂S 濃度之影響較小而且能達到較高 之分解率。然而,比較 RF 電漿於低壓 下分解不同污染氣體時,H₂S 於電漿中 之分解率有偏低現象【15-17】,推測可能 是因為電漿系統中只有硫與氫自由基存在 時,在沒有其他原子參與反應情形下,硫 與氫自由基再結合成 H_2S 之機會較外加其他反應物時多,因此,造成 H_2S 分解率偏低之現象

2. 產物分布之比較

由於電漿系統中,反應物濃度及輸入 功率為影響產物生成之重要因子,因此分 別探討進流濃度為 2500 ppm 及 5900 ppm 時,分解產物隨功率之變化。由圖二可 知,功率小於 10W 時,濃度 2500 ppm H₂S 中之硫轉化成元素硫之質量分率約為 67%, 而 濃度 5900 ppm H₂S 中之硫轉化成 元素硫之質量分率約為 24%,此時 H₂S 分解率也較低(圖一)。當功率增加至 10W 以上, 進流濃度為 2500 ppm 時, H₂S 中之硫轉化成元素硫質量分率隨著H2S分 解率提高而明顯增加,當H2S分解率達 到 99%以上時,H2S 中之硫轉化成元素硫 質量分率則達到85%。當H2S進流濃度為 5900 ppm,增加功率對 H₂S 分解率影響 較小,因此元素硫質量分率變化較不明 顯。

產物中可測得二氧化硫(SO_2)生成, H_2S 中之硫轉化成 SO_2 質量分率隨著功率上升而有些微增加,且隨著 H_2S 進流濃度增加為 5900 ppm 時而有些微增加,因此,推測 SO_2 生成是因為 H_2S 進流氣體中含有不純物質,提供氧之來源造成。

以質量平衡法推估氫氣產生量在不同 進流濃度下,約為 0.5%與 1.2%,然而, 產物中也發現有微量之水產生,此也因為 反應物中含有氧之成分造成,由於 FTIR 無法精確定量出水分含量,因此,推估氫 氣產量要略低於估算值。

3. 硫沈積分析

在電漿系統中,於後電漿區有明顯之淡黃色沈積。沈積物經收集後,以SEM-EDS分析組成,結果發現此沈積物呈現層狀之結構,且以硫為主要元素(圖三)。以XRD分析表面結構指出,沈積物以元素硫(S_x)為主,其中又以熱動力

學上穩定之 $S_8(\alpha)$ 為主要成分(圖四)。

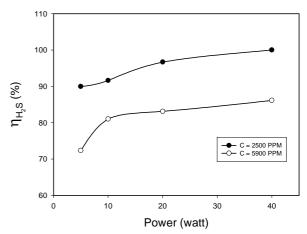
由於 H_2S 受到電子衝擊解離作用 (electron impact dissociation)容易形成 S 及 H 等前驅物,在反應器表面及電漿中,可藉 由 中 性 粒 子 間 作 用 (neutral-neutral interactions)而生成 S_2 。硫原子只能存在於低壓及高溫環境中,而低壓($1\sim10^{-3}$ Torr) 及室溫下, S_2 為硫元素蒸汽之主要成分。一般電漿之電子溫度就足夠讓 H_2S 產生大量之硫與氫自由基,此為 S_2 形成之前驅物,再藉由 two-body 於電漿中形成 S_2 ,也可在低壓系統反應器表面藉由 two-body或 three-body 促成再結合作用,最後於後電漿區結合成穩定性較高之 $S_8(\alpha)$ 結構。相對地,氫自由基也可結合成 H_2 。

五、參考文獻

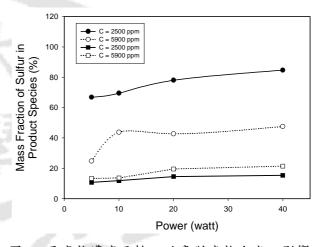
- 1. Wang, R. "Investigation of Hydrogen Sulfide Removal and Sulfur Recovery from Low Sulfur Containing Gases with Aqueous Solution of Heteropoly Compound", *Journal of Chemical Engineering Japan*, 15, 35-, 2002.
- Legator, M. S.; Singleton, C. R.; Morris, D. L.; Philips, D. L. "Health Effect from Chronic Low-Level Exposure to Hydrogen Sulfide", *Archives of Environmental Health*, 56, 123-, 2001.
- 3. Logue, J. N.; Ramaswamy, K. H.; Joel, H. "Investigation of Illness Associated with Exposure to Hydrogen Sulfide among Pennsylvania School Students", *Journal of Environmental Health*, 63, 9-, 2001.
- 4. Nicholos, J. E., Spiers, A. I., Martin, N. A. "Kinetic and Mechanism in the Decomposition of NH₃ in a Radio-Frequency Pulse Discharge", *Plasma Chem. Plasma Process.*, 6, 39-51, 1986.
- 5. Liao, W. T., Lee, W. J., Chen, C. Y., Shih, M. "Decomposition of Ethylene Oxide in the RF Plasma Environment", *Environ. Technol.*, 22, 165-173, 2001.
- 6. Hsieh, L. T., Lee, W. J., Li, C. T., Chang, M.

- B., Chang, H. C. "Converting Methane by Using an RF Plasma Reactor", *Plasma Chem. Plasma Process.*, 18, 215-239, 1998.
- 7. Wang, Y. F., Lee, W. J., Chen, C. Y. Hsieh, L.T. "Decomposition of Dichloro-difluoromethane by Adding Hygrogen in a Cold Plasma System", *En viron. Sci. Technol.*, 33, 2234-2240, 1999.
- 8. Wang, Y. F., Lee, W. J., Chen, C. Y., Hsieh, L.T "Reaction Mechanism in Both a CHF₃/O₂/Ar and CHF₃/H₂/Ar Radio Frequency Plasma Environment *Ind. Eng. Chem. Res.*, 38, 3199-3210, 1999.
- 9. 施明良、李文智、陳志勇、蔡政賢 ,「六 氟化硫於低溫電漿環境中之分解反應」, 第九屆中華民國氣膠科技研討會,雲林, 第416-420頁 1997.
- Liao, W. T., W. J. Lee, C. Y. Chen, L. T. Hsieh, and C. C. Lai., *J. Chem. Technol. Biotchnol.*, 75, 817-827, 2000.
- 11. Wang, Y. F., Lee, W. J. and Chen, C. Y., *Environ. Sci. Technol.*, 33, 2234-2240, 1999.
- Hsieh, L. T., W. J. Lee, C. Y. Chen, Y. P. G.
 Wu, S. J. Chen, and Y. F. Wang, *J. Hazard. Mater.*, 63, 69-90, 1998.
- Chiu, S. W., W. K. Li, W. B. Tzeng, and C. Y. Ng, J. Chem. Phys., 97, 6557-6568, 1992.
- Baldridge, K. K., Gordon, M. S. Johnson, D. E. J. Phys. Chem., 91, 4145-4155, 1987.
- 15. Minliang Shih, Wen-Jhy Lee, Chuh-Yung Chen, "Decomposition of SF₆ and H₂S Mixture in Radio Frequency Plasma Environment", *Industrial and Engineering Chemistry Research*, 42, 2906-2912, 2003.
- 16. Minliang Shih, Wen-Jhy Lee, Perng-Jy Tsai, Chuh-Yung Chen, Cheng-Hsien Tsai, "Decomposition of SF₆ in an RF Plasma Environment" *Journal of the Air & Waste Management Association*, 52, 1274-1280, 2002.
- 17. Cheng-Hsien Tsai, Wen-Jhy Lee, Perng-Jy Tsai, Chuh-Yung Chen, Guor-Cheng Fang, Minliang Shih, "Difference in Conversions between Dimethyl Sulfide and Methanethiol in a Cold Plasma Environment," *Plasma*

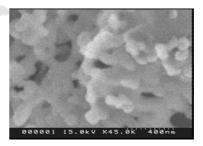
Chemistry and Plasma Processing, 23, 141-157, 2003.



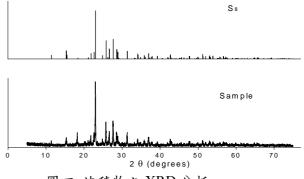
圖一 硫化氫在不同濃度(2500 ppm 及 5900 ppm)與功率下之分解率



圖二 反應物濃度及輸入功率對產物生成之影響



圖三 沈積物之 SEM 分析結果



圖四 沈積物之 XRD 分析